

ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡 JSM-6500F

製造元	日本電子株式会社 購入年度：2003 年度
仕様	ショットキー電界放射電子銃（最高加速電圧 30kV）、アウトレンズ形対物レンズ、二次電子検出器（二次電子像分解能 1.5nm（15kV）、5.0nm（1kV））、反射電子検出器、エネルギー分散型 X 線分析装置
保有部署	材料工学専攻
設置場所	吉田・工学部物理系校舎・地下 1 階 002 室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko
注意事項等	事前講習を受講のうえ、利用者自身で測定してください。 利用目的、試料情報（導電性の有無、組成、形状、個数）を下記連絡先にお知らせください。
連絡先	材料工学専攻 教育研究支援室 技術職員 佐々木 宣治 075-753-5426 sasaki.nobuharu.7a@kyoto-u.ac.jp
キーワード	FE-SEM、EDX、アウトレンズ
機器コード	0000103004
自由記入欄	固体試料表面の組織観察や組成分析を行う電界放出形走査電子顕微鏡です。分解能数 nm 程度の二次電子像観察、B 以降の元素を対象とする検出下限 0.1at.%程度、X 線発生領域 1um 程度の EDX 分析が可能です。

令和6年10月10日現在

